

一般財団法人 金属系材料研究開発センター

2013.1 **No.315**

TODAY

地球環境対策で経済発展-川崎メカニズムの本格施行

一般財団法人機械振興協会 副会長、技術研究所長 東京工科大教授 足立 芳寛

温室効果ガスの中で地球温暖化に対する影響が最も大きい CO₂ の濃度は、産業革命以降上昇を続けている。CO₂ は、排出場所によらず温室効果が同じであるため、総排出量に対する寄与率や増加率の大きな国での削減が望まれる。つまり、温室効果ガスの排出抑制は、我が国の様な省エネ先進国における国内削減処置だけではなく、地球規模での排出抑制が重要である。その排出削減に向けた対策として、フロントランナー方式とキャップ・アンド・トレード方式があり、前者は環境効率の高い製品の普及を、後者は個別の対象への排出制限と排出権の取引制度を設けることで総排出量の抑制を狙っている。

次に、温室効果ガスの排出を製品のライフサイクルを通 して考えてみよう。グローバル化により製品のライフサイ クルの各段階は国をまたぐことも多いが、製品のライフサ イクルを通した排出量が従来製品よりも低減されるよう な製品は、その製造場所、使用場所に関係なく、温室効果 ガスの削減に寄与することは明白である。そのため、製品 のライフサイクルを通した温室効果ガス排出の抑制が重 要である。製品のライフサイクルにおいて環境効率の高い 製品を構成する素材は、生産時に従来製品以上の温室効 果ガスを排出している場合も少なくない。その場合、対象 域外も含めたライフサイクル全体で排出量を削減してい たとしても、生産時の排出量は見かけ上増加している事に なる。企業ごとや地域ごとの温室効果ガス排出制限を設け てしまう(キャップ・アンド・トレード方式だと、このよ うな高効率化を支える生産技術が正当に評価されず、高効 率技術の開発のインセンティブが失われ、旧来の非効率技 術を使用続けることになる。これでは、世界全体での CO。 削減との目標に対し本末転倒である。

そこで筆者らは、生産時に排出量が増加しても、後のライフサイクルステージにおいて削減効果が在れば、その削減効果のうち一部を生産事業者に配分することが合理的と考えるべきと提唱してきた。川崎市では、この考え方を世界で初めて規制施策に導入する事とし、域外での排出削減量の一部を域内の排出量からオフセットする(仮称)川崎メカニズムという画期的モデルとして、平成25年度本格実施される予定である。この新川崎温暖化対策における基本的な考え方が、かわさき原則として、以下の2点に集約されている。

- 製品・技術により、地球全体での温室効果ガスの排 出削減に貢献
- 製品・技術等のライフサイクル全体を考慮した温室 効果ガス排出量の削減

つまり、川崎メカニズムは、市内企業の優れた環境技術により、ライフサイクル全体を考慮した地球規模での温室効果ガスの削減に貢献するため、世界に先駆け、市域外の温室効果ガスの削減貢献量をLCA (life cycle assessment) により算定・評価し、"見える化"し、川崎市内の優れた環境技術、製品を海外に輸出し、世界の排出削減に貢献しようとする制度である。

具体的な事例として、自動車の軽量化に供されるハイテン(高強度鋼)を挙げる。強度が高くない鋼材を用いた場合をベースラインとし、50%ハイテン化された場合を想定する。図1に示すように、原料調達と輸送、製品使用時で温室効果ガス削減効果がある一方で、生産段階での温室効果ガスの増加が見られる。これらの増減を加味すると、ライフサイクル全体では4.0%の削減効果が見込まれるが、これらは、素材の生産地域とは異なる地域、川崎市外での CO_2 の削減に貢献している。この貢献を下支えするために増エネした素材製造に、この削減効果を配分しようというのが、川崎メカニズムのコンセプトである。

なお、私事でありますが、筆者は昨年9月末をもって、 在職15年、卒業生100名余りを数えた東京大学を定年 退官し、現職に異動したところであるが、研究室は、後 藤芳一教授、醍醐市朗准教授に引き継がれていますので、 こちらの方も読者諸氏の更なるご支援をお願いする次第 です。

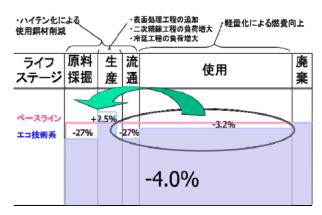


図 1 自動車のハイテン化によるライフサイクルでの 温室効果ガス排出量変化

GaN 基板による高効率・高品質 LED 照明* ~次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発~

高品質 GaN 結晶の低コスト・量産化技術の開発 大阪大学 大学院 教授 森 勇介

高効率・高品質 LED 用 GaN 基板 の開発では、欠陥 (転位)・歪等が 少なく高品質であることと、低コス トであることの両立が重要です。本 プロジェクトでは、Naフラックス 法(高温の Ga-Na 融液に窒素ガスを 加圧し、GaN単結晶を液相中で作製 する液相成長の手法)を用いて、低 転位かつ大口径 GaN 基板の実現を目 指しています。

ポイントシード技術により GaN 基 板特有の綺麗な結晶面が広く出現し たセンチメーターサイズの GaN 単 結晶成長に成功しました。これは六 角形状バルク GaN 単結晶としては、 世界一のサイズです。加えて、この 結晶には転位と呼ばれる線欠陥が存 在せず、Spring-8 での高平行度 X 線 ビームを用いた評価によると、化合 物半導体では初めての完全結晶であ ることがわかりました。

ポイントシード技術を応用した結 合成長技術は、個々には無転位の GaN単結晶を複数結合させること で、大口径化を目指す画期的な手法 です。最近の実験では、歪が限りな く少ない2インチGaN 基板の作製 に成功しています。

Na フラックス法とポイントシー ド技術、及び結合成長技術の組み合 わせにより、低転位かつ大口径 GaN 基板の実現が期待できます。

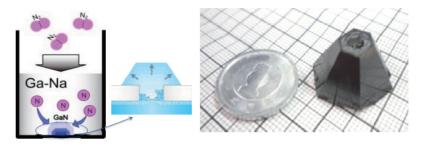


図1 Na フラックス法+ポイントシード技術

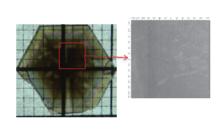


図2 カソードルミネッセンス評価 転位密度:ほぼ全面でゼロ

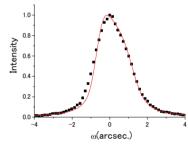


図3 X線ロッキングカーブ 半値幅 1.83 秒 (理論値: 1.81 秒)

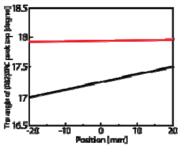


図4 X線による反り評価

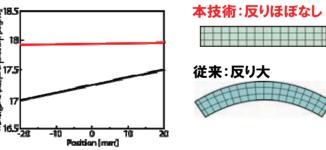




図 5 結合成長技術



図6 結合成長技術で得られた 2インチ自立 GaN 基板

高演色性・高効率 LED デバイスのためのエピ技術開発 名古屋大学 大学院 教授 天野 浩

Na フラックス法で試作した低転位・ 高品質 GaN 基板上に LED を試作した ところ、内部量子効率は、波長500 nm の青緑色で 90%、波長 530 nm の 純緑色で 60%を、電流密度 200A/cm² にて確認できました。このように高い 電流密度では世界最高値です。

従来のサファイア基板上では、青色 LED でも電流密度 < 10A/cm² で同程度、 200A/cm²ではその 65-70%が限界で

更に重要なことは、LED作製に必要 な時間が1時間以内と短いことです。 従来は、最低でも4時間以上必要でし た。これは、実用上プロセス時間の短 縮につながり、コスト低減にとって重 要な成果といえます。

加えて本研究プロジェクトでは、従 来の MOVPE 成長法では困難であった ピットの発生をその場観察する方法を 開発し、更に LED の発光波長及び効率 を決める最も重要なデバイスパラメー タである InGaN 量子井戸活性層中の In 組成及び膜厚を原子レベルでその場観 察する手法を開発しました。これによ り、100%の歩留まりで、欠陥のない 所望の構造を有する LED のエピタキ シャル成長が可能になりました。

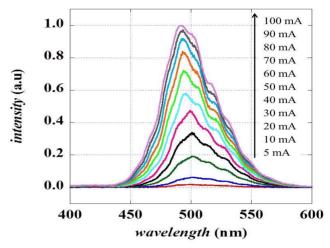


図7 大電流密度駆動で世界最高の内部量子効率を確認

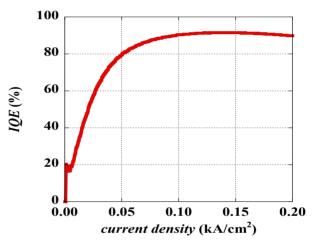
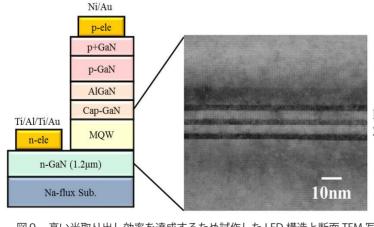


図8 大電流密度駆動で世界最高の内部量子効率を確認



InGaN/GaN 3OWs 2.5nm/5nm

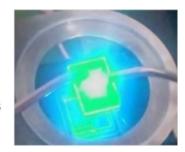


図 10 LED デバイスの発光例

図9 高い光取り出し効率を達成するため試作した LED 構造と断面 TEM 写真

|*このレポートの内容は独立行政法人||新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) の委託事業「次世代照明等の実| 現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発」の中で得られた成果の一部です。NEDO では毎年1、2月に開催される「国 際ナノテクノロジー総合展・技術会議(nano tech)」に機構を挙げて取り組んでおり、今年度は、「次世代照明プロジェ クト」の成果を出展することになりました。(次ページにその案内を掲載しました。)

2月1日(金)13:00にこのレポートの詳細が大阪大学の森勇介教授から NEDO ブースにてプレゼンテーションされます。

国際学会参加報告

■ IWN-2012 に参加

昨年10月14日(日)から19日(金)にかけて、札幌のコンベンションセンターにて、窒化物半導体に関する国際学会、IWN-2012(International Workshop on Nitride semiconductors)が開催された。今回は、窒化物半導体分野の技術を牽引している日本での開催ということもあり、参加者1000人以上と大変盛況であった。技術範囲が広がる中で聴講したセッションは限られるが、いくつかの技術トレンドを伺うことができた。

バルク成長技術については、テンプレート基板を 種とした気相法による GaN 層成長や液相法の GaN バルク成長に関する報告が相次ぎ、エピ成長技術については、各種光デバイス向けを中心に非極性面上のエピ成長やその発光特性の向上、また、装置メーカーから8インチSi基板上のエピ成長の報告があり注目された。また、デバイス技術については、特に電子デバイスに関する報告が活況で、高耐圧化や高周波数化が進展し、またSi-CMOSとのハイブリッド化の報告があった。自動車メーカーより車載用パワーデバイス用途への展望に関する報告もあり、応用市場のGaNパワーデバイスへの期待も、本格化していることを実感することができた。

(非鉄材料研究部 主席研究員 櫻田 隆)

Nano tech 2013 の紹介

2013年1月30日(水)~2月 1日(金)に東京国際展示場(東京 ビッグサイト)で開催される「nano tech 2013 第12回国際ナノテク ノロジー総合展・技術会議」におい て、NEDO委託事業「次世代照明等 の実現に向けた窒化物半導体等基盤 技術開発(H19~H24)」の成果を NEDOブース内にて展示します。

nano tech はナノテクノロジー分野に関する約600企業・団体が出展し、約50,000人の来場者が訪れる世界最大規模の展示会です。東4ホール入口に位置するNEDOブースでは、ナノテクノロジー・材料分野に関する27テーマのNEDOプロジェクト成果が展示されます。

今回は、「次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発」の成果として、Naフラックス法で作製した GaN 完全結晶、大型 GaN 基板の実物展示やパネルでのわかりやすい解説がなされます。

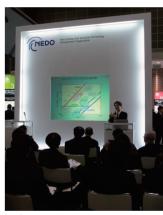
また、2月1日(金)13:00からは、 NEDOブース内において森教授のプレゼンテーションが行われますので、 是非足をお運び頂ければ幸いです。



昨年度の Nano tech 風景



NEDO ブース外観



プレゼンテーションブース の様子



出展ブースでの説明風景



展示した各種 GaN 基板及び バルク結晶

The Japan Research and Development Center for Metals JRCM NEWS /第 315 号

内容に関するご意見、ご質問は JRCM 総務企画部までお寄せください。 本書の内容を無断で複写・複製・転載することを禁じます。 発 行 2013年1月1日

発行人 小紫 正樹

発行所 一般財団法人 金属系材料研究開発センター

〒 105-0003 東京都港区西新橋一丁目 5 番 11 号 第 11 東洋海事ビル 6 階

TEL (03)3592-1282 (代) / FAX (03)3592-1285

ホームページ URL http://www.jrcm.or.jp/

E-mail jrcm@oak.ocn.ne.jp